

TMap dag 2016



De Yin & Yang van het BI-testen

Mijcke Peek, Armando Dörsek

Cinemec Utrecht, 6 oktober 2016





- ▶ **Wie zijn wij?**
- ▶ **Ontwikkelingen in de BI**
- ▶ **Zoom in: opkomst van de BI-tester**
- ▶ **Zoom in: het speelveld van de BI-tester**
- ▶ **Zoom in: rollen binnen BI-test**
- ▶ **Afronding**

Wie zijn wij?



▶ Armando Dörsek



▶ BI Testconsultant en -manager



▶ Mijcke Peek



▶ BI-Specialist

Ontwikkelingen in de BI



Ontwikkelingen in de BI (2)



Mens

Van AO en ICT naar
Data Science

Van beslissingsondersteuning
naar volledig vertrouwen

Middel

Scala aan tools
voor bouw,
beheer en testen

Data als kans én
als risico

Afkortingen van
nu:
IoT, AI, DV, VR

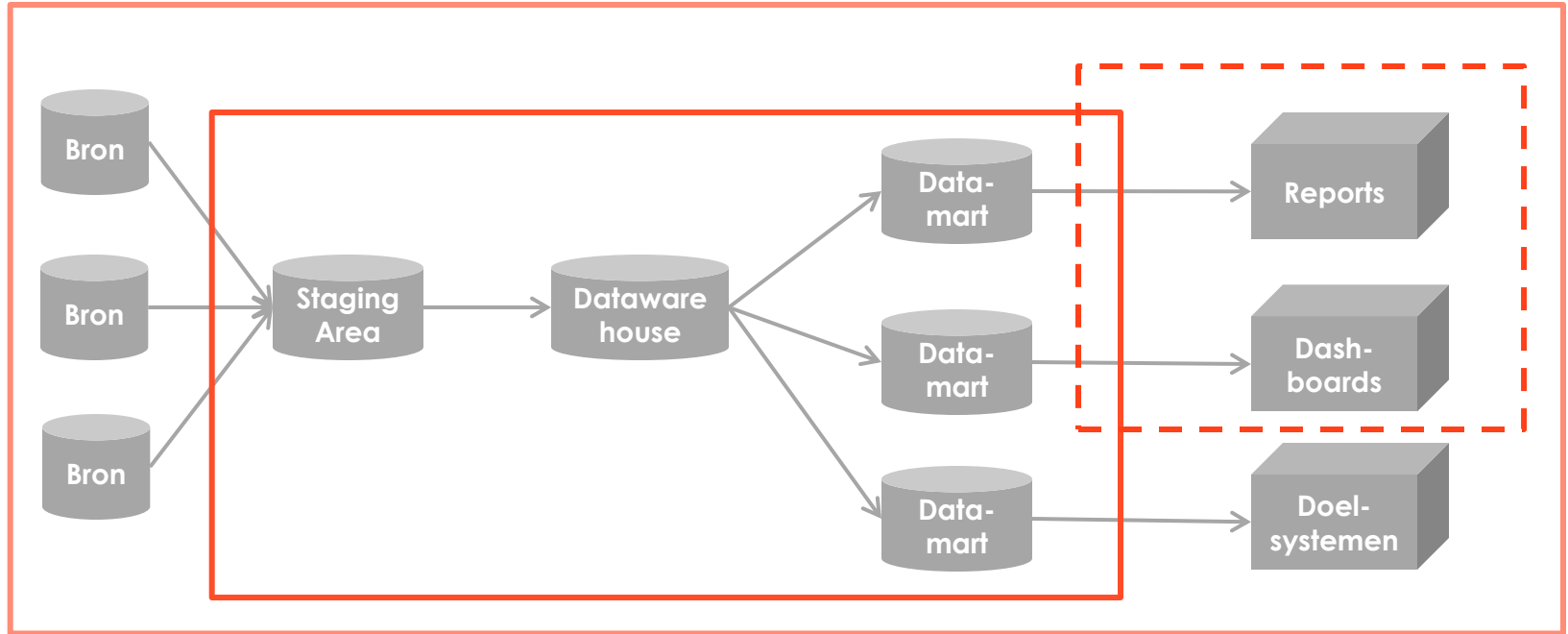
Methode

Via best practices naar standaarden: o.a. DAMA, Data Vault, etc.

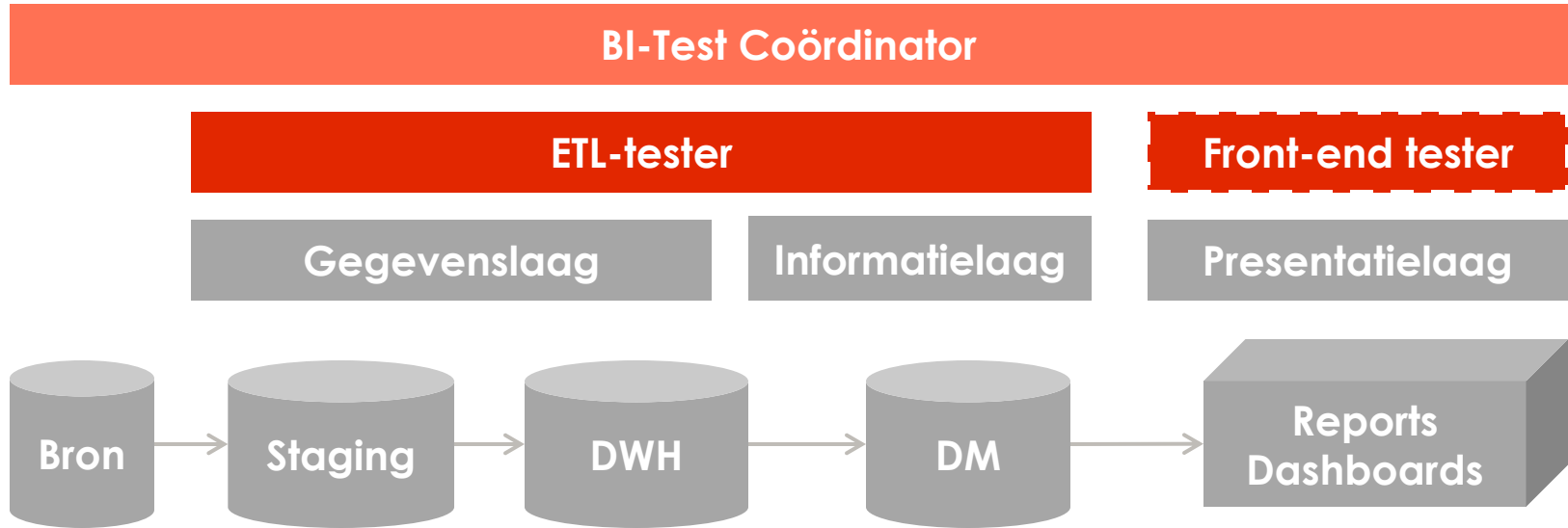
Zoom in: opkomst van de BI-Tester



Zoom in: speelveld van de BI-tester



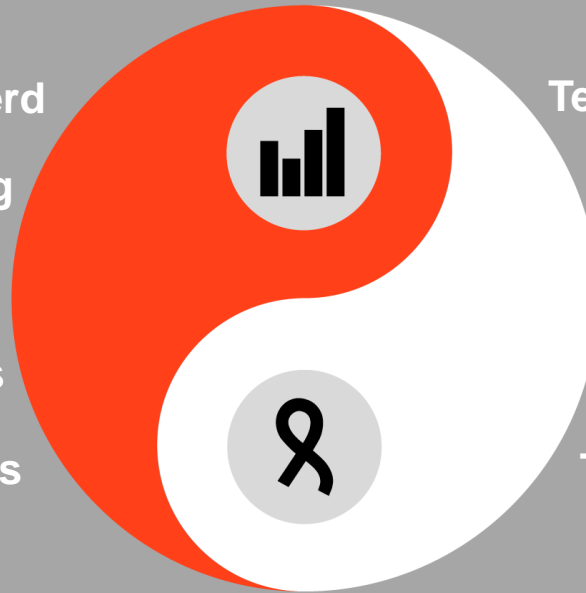
Zoom in: rollen binnen BI-test



Yin en Yang



Data georiënteerd
Data modellering
ETL
BI-principes
BI toolkennis



Testtechnieken
Testmethoden
TMap Next
ISTQB
Test automation

Meer weten?



▶ Armando Dörsek



 www.linkedin.com/in/dorsek
 armando.dorsek@verified.nl



▶ Mijcke Peek



 nl.linkedin.com/in/mijckeppeek
 mijcke.peek@sogeti.com